

Зам. Председателя совета по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук
Д 212.243.01 на базе Саратовского
государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского
профессору, д.ф.-м.н. А.В. Скрипалю

На № 3/4244 от 17.10.19

СОГЛАСИЕ
официального оппонента

Я, **Быков Виктор Александрович**

Ученая степень: доктор технических наук

Ученое звание: профессор

Место работы: Группа компаний НТ-МДТ Спектрум Инструментс (НТ-МДТ СИ)

Должность: Почетный президент

Согласен выступить в качестве официального оппонента по диссертации

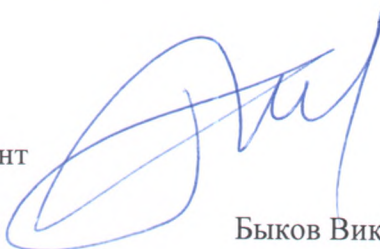
Бочковой Татьяны Сергеевны

Представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специальностям 01.04.03 – Радиофизика и 05.7.01 – Твердотельная электроника,
радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых
эффектах

на тему: «Особенности взаимодействия электромагнитного излучения
сверхвысокочастотного и оптического диапазонов с формирующимися в магнитном поле
агломератами ферромагнитных наночастиц магнитной жидкости»

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их
дальнейшую обработку.

Доктор технических наук,
Профессор МФТИ, Почетный президент
Группы компаний НТ-МДТ
Спектрум Инструментс (НТ-МДТ СИ)



Быков Виктор Александрович

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертационной работе Бочковой Татьяны Сергеевны на тему «Особенности взаимодействия электромагнитного излучения сверхвысокочастотного и оптического диапазонов с формирующимися в магнитном поле агломератами ферромагнитных наночастиц магнитной жидкости», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальностям 01.04.03 – радиофизика и 05.27.01 – твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах

Фамилия, имя, отчество	Быков Виктор Александрович
Гражданство	РФ
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук, 05.27.01 - твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах, 01.04.01 - приборы и методы экспериментальной
Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор МФТИ
Место работы:	
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, электронный адрес организации	124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд №4922, д. 4, стр. 3. www.ntmdt-si.ru e-mail: info@ntmdt-si.com
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Группа компаний НТ-МДТ Спектрум Инструментс (НТ-МДТ СИ)
Наименование подразделения	---
Должность	Почетный президент
Список публикаций оппонента по теме диссертации соискателя в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (в том числе обязательно указание публикаций за последние 3 года):	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Density Control of InP/GaInP Quantum Dots Grown by Metal-Organic Vapor-Phase Epitaxy / D.V. Lebedev, N.A. Kalyuzhnyy, S.A. Mintairov, K.G. Belyaev, M.V. Rakhlin, A.A. Toropov, P. Brunkov, A.S. Vlasov, J. Merz, S. Rouvimov, S. Oktyabrsky, M. Yakimov, I.V. Mukhin, A.V. Shelaev, V.A. Bykov, A.Yu. Romanova, P.A. Buryak, A.M. Mintairov // Semiconductors, 2018. - V. 52, N 4. - P. 497-501. 2. Быков В., Поляков В. Новые решения для материаловедения, комплексного исследования и контроля материалов и структур с высоким пространственным разрешением // Наноиндустрия. – 2017. – № 2 (72). – С.58-72. 3. В.А. Быков А.В., Шикин С.А. Сканирующий зондовый микроскоп // Патент на изобретение РФ №2494406. Опубликовано: 14.12.2009 	

4. Skorokhodov, E. V., Sapozhnikov, M. V., Reznik, A. N., Polyakov, V. V., Bykov, V. A., Volodin, A. P., & Mironov, V. L. A Magnetic Resonance Force Microscope Based on the Solver-HV Probe Complex // Instruments and Experimental Techniques. – 2018. – V.61. – №5. – P. 761–765.
5. К научному приборостроению для нанотехнологии: сканирующая зондовая микроскопия / **В.А. Быков**, В.В. Поляков, А.С. Калинин А.В. Шелаев // Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника, 2017. - №2 (166). – С. 30-44.
6. Метод атомно-силовой микроскопии для неразрушающего анализа температурной динамики электромеханических свойств наноструктур / А.С. Калинин, В.В. Атепалихин, В.В. Поляков, **В.А. Быков** // Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника, 2017. - №3 (167). – С. 28-32.

Официальный оппонент,
д.т.н., профессор МФТИ



Быков Виктор Александрович

Заверяю:
Ученый секретарь
ГК «НТ-МДТ Спектрум
Инструментс»
к.ф.-м.н.





В.Н. Рябоконт